

# „Mein Programm“ erstellen

Anleitung



50. METALLOGRAPHIE-TAGUNG

**MATERIALOGRAPHIE**  
METALLE - KERAMIK - POLYMERE

Gehen Sie auf die  
Veranstaltungswebseite.  
Klicken Sie auf "Login".

Einreichungen von Postern sind noch möglich!

21. bis 23. September 2016 in Berlin



Sponsor Best Paper 2016 "Zeitschrift  
Praktische Metallographie"





DGM - Jahresmagazin -  
Materialographie/Metallographie



Sponsor des Posterpreises 2016

## Login

	<input type="text" value="E-Mail"/>
	<input type="password" value="Passwort"/>

Login

Sie haben noch kein  
Benutzerkonto?

Registrieren

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und  
Passwort ein und klicken Sie auf  
"Login".

zurückzusetzen.

PROGRAMM ▾

KONFERENZ ▾

ORT ▾

AUSSTELLUNG ▾

**ANMELDUNG** ▾

KONTAKT ▾

Gehen Sie auf "Programm".

Sie sind eingeloggt

Veranstaltungsteilnahme anmelden

Einreichungen verwalten

Mein Benutzerkonto

Symposium

A: Präparationstechniken zur Vorbereitung der (Licht- und Elektronen-) Mikroskopie

Beschreibung:

Klicken Sie auf einen Vortrag.

- Eröffnung und Preisverleihung
- A: Präparationstechniken zur Vorbereitung der (Licht- und Elektronen-) Mikroskopie
- B: Einsatz der Mikroskopie bei der Materialentwicklung
- C: Gefügeuntersuchungen zur Bewertung von Schadensfällen
- D: Korrelation von Gefüge und Eigenschaften
- G: Anwendungen in allen Materialklassen (Metalle, Keramik, Verbundwerkstoffe, Polymere)
- Kolloquium für Prof. Dr. G. Petzow
- Postersession

Wählen Sie ein Thema aus, das Sie interessiert. Unter „Suche“ stehen Ihnen verschiedene Filtermöglichkeiten zur Verfügung.

Mittwoch (21.09.2016)

16:35	<p>A1: Präparationstechniken zur Vorbereitung der (Licht- und Elektronen-) Mikroskopie Session beginnt um 16:35 Uhr</p> <p><b>FIB/REM Serienschnitte mit EDX und EBSD am Beispiel von Al-Gusslegierungen, Gusseisen und Elektrowerkstoffen</b></p> <p>Michael Engstler Christoph Pauly Prof. Dr. Frank Mücklich</p>	Vortrag
16:55	<p>A1: Präparationstechniken zur Vorbereitung der (Licht- und Elektronen-) Mikroskopie Session beginnt um 16:35 Uhr</p> <p><b>Das Eutektikum - ein Ausflug ins „Schöngefügte“ - Kristallisation und Ausbildungsformen eutektischer Gefüge</b></p> <p>Gaby Ketzer-Raichle Dr. Timo Bernthaler Prof. Dr. Gerhard Schneider</p>	Vortrag
17:15	<p>A1: Präparationstechniken zur Vorbereitung der (Licht- und Elektronen-) Mikroskopie Session beginnt um 16:35 Uhr</p> <p><b>Korrelative Mikroskopie zur Charakterisierung und Quantifizierung komplexer Phasenbestandteile in niedriglegierten Stählen</b></p> <p>Dominik Britz Johannes Webel Prof. Dr. Frank Mücklich</p>	Vortrag
17:35	<p>A1: Präparationstechniken zur Vorbereitung der (Licht- und Elektronen-) Mikroskopie Session beginnt um 16:35 Uhr</p> <p><b>Quantitative metallography of multiphase steels</b></p> <p>Dipl.-Ing. Peter Kirbiš Dr. Mihael Bruncko Dr. Tatjana Vecko Pirtovsek Prof. Dr. Ivan Anžel</p>	Vortrag
17:55	<p>Pausen</p> <p><b>Kurzpause - Ende des ersten Veranstaltungstages</b></p>	Pause

Suche zurücksetzen

Datum (alle)

- Mittwoch (21.09.2016)
- Donnerstag (22.09.2016)
- Freitag (23.09.2016)

Textsuche

Suchtext

Vortragstypen (alle)

- Pause
- Vortrag

Veranstaltungen (alle)

- Session A1: Präparationstechniken zur Vorbereitung der (Licht- und Elektronen-) Mikroskopie
- Session A2: Präparationstechniken zur Vorbereitung der (Licht- und Elektronen-) Mikroskopie
- Session A3: Präparationstechniken zur Vorbereitung der (Licht- und Elektronen-) Mikroskopie



[Zurück zur Übersicht](#)

Vortrag

## FIB/REM Serienschnitte mit EDX und EBSD am Beispiel von Al-Gusslegierungen, Gusseisen und Elektrowerkstoffen

☆ Zu meinem Programm hinzufügen

Klicken Sie auf "Zu meinem Programm hinzufügen."

### Teil der Session:

#### A1: Präparationstechniken zur Vorbereitung der (Licht- und Elektronen-) Mikroskopie

Mittwoch (21.09.2016)

16:35 - 17:55 Uhr

Die Focused Ion Beam Technik (FIB), kombiniert mit der Rasterelektronenmikroskopie (REM) hat sich mittlerweile in vielen Bereichen der Werkstoffcharakterisierung etabliert. Zu den häufigsten Anwendungsfeldern gehören die zielgenaue Herstellung von Querschnitten, die Zielpräparation für die Transmissionselektronenmikroskopie und die Atomsondentomographie, sowie die 3D Charakterisierung von Werkstoffgefügen mittels FIB/REM Serienschnitten. Bei der FIB/REM Serienschnitttechnik wird der interessierende Probenbereich schrittweise mittels FIB abgetragen und die freigelegten Querschnittsflächen mit dem REM abgebildet. Standardmäßig wird dabei die Sekundär- oder Rückstreuelektronenabbildung (SE bzw. RE) genutzt. Eine Integration einer chemischen Analyse mittels energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX) oder einer Analyse von Phase und Orientierung der Kristallite mittels Rückstreuelektronenbeugung (EBSD) ist möglich, wenn auch aufgrund von experimentellen Besonderheiten nicht üblich. Da jedoch der Vorteil dieser Tomographiemethode gerade in der Vielseitigkeit der möglichen Kontraste liegt, soll in der vorliegenden Arbeit ein Überblick über die experimentellen Randbedingungen der FIB/REM Serienschnitte gegeben werden und am Beispiel verschiedener Werkstoffe auf die experimentellen Besonderheiten der FIB/REM Serienschnitte mit EDX und EBSD eingegangen werden.

### Sprecher/Referent:



**Michael Engstler**  
Universität des Saarlandes

### Weitere Autoren:

- Christoph Pauly  
Universität des Saarlandes
- Prof. Dr. Frank Mücklich  
Universität des Saarlandes

Symposium

### A: Präparationstechniken zur Vorbereitung der (Licht- und Elektronen-) Mikroskopie

A1: Präparationstechniken zur Vorbereitung der (Licht- und Elektronen-) Mikroskopie Session

Mittwoch (21.09.2016)

16:35 - 17:55 Uhr

A2: Präparationstechniken zur Vorbereitung der (Licht- und Elektronen-) Mikroskopie Session

Donnerstag (22.09.2016)

09:00 - 09:20 Uhr

A3: Präparationstechniken zur Vorbereitung der (Licht- und Elektronen-) Mikroskopie Session

Donnerstag (22.09.2016)

09:45 - 10:45 Uhr

A4: Präparationstechniken zur Vorbereitung der (Licht- und Elektronen-) Mikroskopie Session

Freitag (23.09.2016)

09:35 - 10:35 Uhr

A5: Präparationstechniken zur Vorbereitung der (Licht- und Elektronen-) Mikroskopie Session

Freitag (23.09.2016)

11:10 - 12:10 Uhr

Mein Programm

Unter "Mein Programm" steht Ihnen nun Ihre Programmauswahl zur Verfügung.

Mittwoch (21.09.2016)

16:35

Aus meinem Programm entfernen

A1: Präparationstechniken zur Vorbereitung der (Licht- und Elektronen-) Mikroskopie  
Session beginnt um 16:35 Uhr

Vortrag

**FIB/REM Serienschnitte mit EDX und EBSD am Beispiel von Al-Gusslegierungen, Gusseisen und Elektrowerkstoffen**

Michael Engstler Christoph Pauly Prof. Dr. Frank Mücklich

Freitag (23.09.2016)

11:10

Aus meinem Programm entfernen

D2: Korrelation von Gefüge und Eigenschaften  
Session beginnt um 11:10 Uhr

Vortrag

**Verständnis für die Entstehung des Gefüges bei additiv gefertigten Wolframkarbid-Kobalt-Hartmetallen**

Tim Schubert Dr. Timo Bernthaler Prof. Dr. Gerhard Schneider Dr. Dirk Sellmer Matthias Schneider

Suche

zurücksetzen

Datum (alle)

Mittwoch (21.09.2016)

Freitag (23.09.2016)

Textsuche

Suchtext

Vortragstypen (alle)

Vortrag

Veranstaltungen (alle)

Session A1:  
Präparationstechniken zur  
Vorbereitung der (Licht- und  
Elektronen-) Mikroskopie

Session D2: Korrelation von  
Gefüge und Eigenschaften